

意匠分類記号	意匠分類の名称
J1-52	半導体検査機器

対応する旧意匠分類			※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	※	分類の名称 または 移行した物品	
J1-511	一	半導体用検査機	

参考分類・参考物品	
分類記号	分類の名称 または 物品の名称

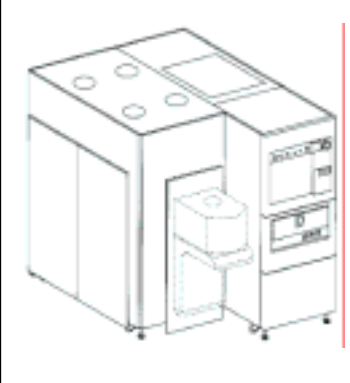
再掲載指示	
分類記号	分類の名称 または 物品の名称

この分類に含まれる物品		
半導体素子用欠陥検査器	半導体用シリコン結晶検査器	半導体用検査器

定義

半導体の検査、試験等に用いる機器。

登録1128086号  
半導体材料用表面検査器  
J1-52



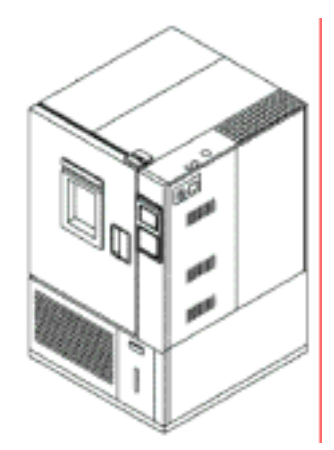
登録1178137号  
プリント基板外観検査機 J1-52



登録1096493号  
半導体ウェーハ検査機 J1-52



登録1117861号  
恒温恒湿槽  
J1-52



他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

過去に分類した物品の名称